

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

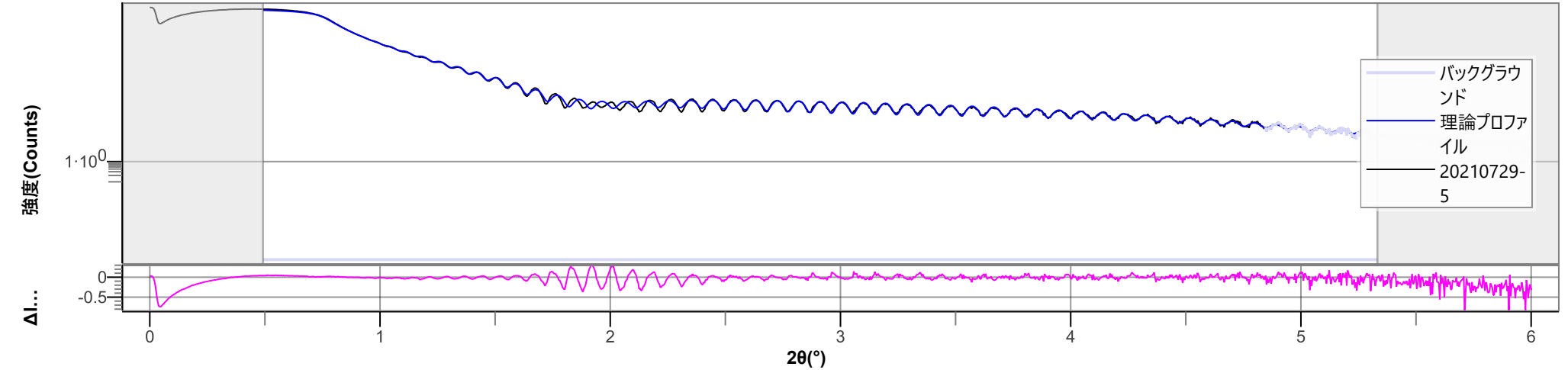
波長(nm): 0.1540593
点数: 1501
2θ(°):開始 = 0.000, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 9.27e-003

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe2O3	0.893 Const	3.15171 Const	1.123 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	1.230 Const	4.37114 Const	0.300 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe	0.978 Const ±3 精密化	5.16544 Const	0.000 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	89.998 Const	7.76729 Const	0.100 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	2.399 Const	4.44265 Const	0.718 Con...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	